

**Учебно-методическая литература по дисциплине  
«Методы исследования состава вещества»**

- 1) Драгунов В. П. Основы нанoeлектроники / В. П. Драгунов, И.Г. Неизвестный, В.А. Гридчин. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2000. 340 с.
- 2) Брандон Д. Микроструктура материалов. Методы исследования и контроля / Д. Брандон, У. Каплан. – М. : Техносфера, 2004. – 384 с.
- 3) Бахтизин .Р.З. Сканирующая туннельная микроскопия – новый метод изучения поверхности твердых тел / О.З. Бахтизин // Соросовский образовательный журнал. – 200. – №11.
- 4) Биркс Л.С. Рентгеновский микроанализ с помощью электронного зонда / Л.С. Биркс. – М. : Металлургия, 1966. – 216 с.
- 5) Кузяков Ю.Я. Методы спектрального анализа / Ю.Я. Кузяков, К.А. Семенов, Н.Б. Зоров. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 213 с.
- 6) Микроанализ и растровая электронная микроскопия / Ред. Ф. Морис. – М. Металлургия, 1985, 392 с.
- 7) Нанотехнологии для микро- и оптоэлектроники / Мартинес-Дуарт Дж.М., Мартин- Пальма Р. Дж., Агулло-Руеда Ф. - М.: Техносфера, 2007. - 368 с.
- 8) Нанотехнология в электронике. Введение в специальность: учебное пособие. 2-е изд., исп. / Лозовский В.Н., Константинова Г.С., Лозовский С.В. - СПб.: Изд. «Лань», 2008. - 336 с.
- 9) Зенгуиль Э. Физика поверхности. М.: Мир, 1990. 536с.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПОДПИСАНО

**ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ**, Круглов Сергей Александрович,  
Заведующий кафедрой ПЭЛ

**01.09.25** 19:50 (MSK)

Простая подпись